

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Иванов Ю.А., Мешков С.А., Синякин В.Ю., Федоренко И.А., Федоркова Н.В., Федоров И.Б., Шашурин В.Д.* Повышение показателей качества радиоэлектронных систем нового поколения за счет применения резонансно-туннельных нанодиодов // Наноинженерия. – 2011, №1, с. 34-43.
2. *Иванов Ю.А., Малышев К.В., Федоркова Н.В.* Нанoeлектроника на базе многослойных гетероструктур // Известия ВУЗов. Машиностроение. – 2003, № 5, с. 73-78.
3. *Иванов Ю.А., Мешков С.А., Федоркова Н.В., Федоренко И.А.* Улучшение параметров приемника СВЧ-диапазона применением резонансно-туннельного нанодиода в преобразователе частоты // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. Спец. выпуск "Наноинженерия". – 2010, с. 128-137.
4. *Синякин В.Ю., Иванов Ю.А., Макеев М.О., Мешков С.А.* Использование РТД в выпрямителях ВЧ сигналов малой мощности // INTERMATIC – 2015 / Материалы Международной научно-технической конференции. – Москва, 2015, ч. 5, с. 93-95.
5. *Frensley W.R.* Quantum transport calculation of the small-signal response of a resonant tunneling diode // Appl. Phys. Lett. 1987. V. 51, I. 6. P. 448-450.
6. *Глудкин О.П.* Методы и устройства испытаний РЭС и ЭВС: Учеб. для ВУЗов. – М.: Высш. шк., 1991. – 336 с.: ил.
7. *Макеев М.О., Литвак Ю.Н., Иванов Ю.А., Мешков С.А., Мигаль Д.Э.* dif2RTD: свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2012661001. 2012.
8. *Makeev M.O., Ivanov Y.A., Meshkov S.A.* Quality diagnostics of nanoscale AlAs/GaAs resonant tunnelling heterostructures based on IR-spectroscopic ellipsometry // J. Phys.: Conf. Ser. – 2015. V. 584. 012014. doi:10.1088/1742-6596/584/1/012014.
9. *Макеев М.О., Иванов Ю.А., Мешков С.А.* Оценка стойкости к диффузионной деструкции наноразмерных AlAs/GaAs резонансно-туннельных гетероструктур методом ИК-спектральной эллипсометрии // Физика и техника полупроводников. –2016. Том 50, вып. 1. С. 83-88.
10. *Mehrer H.* Diffusion in Solids. Fundamentals, Methods, Diffusion-controlled Processes. Leipzig: LE-TEX Jelonek // Schmidt & Vockler GbR. 2007. 645 p.
11. *Fisher D.J.* Diffusion in GaAs and other III-V Semiconductors 10 Years of Research. Switzerland: Scitec Publications. 1998. 520 p.
12. *Макеев М.О., Иванов Ю.А., Мешков С.А.* Исследование деградационных явлений в наноразмерных AlAs/GaAs гетероструктурах методом ИК-спектроскопии эллипсометрии // Наноинженерия. – 2011. № 4. С. 44-48.